

- [1] А б д у л л и н Э.И., Б а ж е н о в Г.П., К и м А.А., К о в альчук Б.М., К о к ш е н о в В.А. - Физика плазмы, 1986, т. 12, № 10, с. 1260-1264.
- [2] Г о л о в а н о в Ю.П., Д о л г а ч е в Г.И., З а к а т о в Л.П., С к о р ю ш и н В.А. - Физика плазмы, 1988, т. 14, в. 7, с. 880-885.
- [3] K a n i a D.R., J o n e s L.A., Z i m m e r - m a n n E.L., V e e s e r L.R. and T r a i - n o r R.J. - Appl. Phys. Lett., 1984, 44(8), p.741-743.
- [4] M e g e r R.A., C o m m i s o R.J., C o o p e r - s t e i n G., and S h y k e A. G o l d - s t e i n. - Appl. Phys. Lett., 1983, 42(11), p.943-945.
- [5] O t t i n g e r P.F., G o l d s t e i n S.A. and M e g e r R.A. - J. Appl. Phys., 1984, 56(3), p.774-784

Поступило в Редакцию
4 ноября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

ТЕРМОГРАДИЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
СВОБОДНОЙ ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН

А.А. У г л о в, С.В. С е л и щ е в

Температурный градиент (β) вблизи свободной плоской поверхности жидкости может являться причиной ее неустойчивости к возникновению капиллярных волн [1-3]. Для реализации конкретного механизма неустойчивости существенное значение имеет знак β при $z \rightarrow 0-$, где начало координат находится на невозмущенной свободной поверхности жидкости, а ось z направлена из жидкости в газовую среду. В [1] для развития неустойчивости необходимо $\beta > 0$, в [2] $\beta < 0$. В [3] неустойчивость, приводящая к возникновению капиллярных волн, развивается при $\beta > 0$, а при $\beta < 0$ развивается апериодическая неустойчивость.

Важное, в том числе и для практических приложений [4], общее свойство механизмов этих неустойчивостей заключается в том, что для их развития величина β должна быть достаточно большой. Казалось бы, что при дальнейшем закритическом увеличении β неустойчивость должна развиваться интенсивней. Однако, как показано в данной работе, при достаточно большом β вне зависимости от его знака и числа Прандтля (P_r) жидкости ее свободная плоская поверхность всегда устойчива к возникновению капиллярных волн.

Используя [1-3], рассмотрим следующие граничные условия на свободной плоской поверхности жидкости:

$$\frac{\partial h}{\partial t} - \sigma = 0, \quad (1)$$

$$\zeta \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \rho - 2\eta \frac{\partial \sigma}{\partial z} = 0, \quad (2)$$

$$-\frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial \theta}{\partial x} - \frac{\partial h}{\partial x} \cdot \frac{\partial \beta}{\partial T} \cdot \beta + \eta \left(\frac{\partial \sigma}{\partial z} + \frac{\partial \omega}{\partial x} \right) = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0, \quad (4)$$

где t - время, h - возмущение поверхности жидкости, σ - возмущение нормальной компоненты скорости жидкости, ω - тангенциальной, ζ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, η - ее вязкость, x - координата вдоль плоской поверхности жидкости, ρ - возмущение давления жидкости, θ - возмущение температурного поля (T) жидкости, $\beta = \partial T / \partial z$.

Возмущение температурного поля жидкости определяется уравнением

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\sigma \beta + g \left(\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2} \right), \quad (5)$$

а возмущение поля скоростей

$$\frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial z} = 0, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} + \frac{\eta}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial z^2} \right), \quad (7)$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \left(\frac{\partial^2 \sigma}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma}{\partial z^2} \right), \quad (8)$$

где g - коэффициент температуропроводности жидкости, ρ - ее плотность. Кроме того, считаем, что

$$\sigma = \omega = \theta = 0 \quad \text{при} \quad z \rightarrow -\infty. \quad (9)$$

Из (5)-(9) следует

$$\sigma = \exp(i\omega t - imx) [N_1 \exp(-im_1 z) + N_2 \exp(-im_2 z)], \quad (10)$$

$$m > 0, \quad m_1 = im, \quad i\omega = -\frac{\eta}{\rho} (m_2^2 + m^2), \quad (11)$$

$$\theta = \exp(i\omega t - imx) [N_3 \exp(-i\mu_3 z) - \frac{\beta}{i\omega} (N_1 \exp(-i\mu_1 z) + \\ + \frac{\rho_x}{\rho_x - 1} N_2 \exp(-i\mu_2 z))], \quad (12)$$

$$i\omega = -g(\mu_3^2 + m^2), \quad (13)$$

где m – волновое число для возмущений вдоль поверхности жидкости, слагаемое $\sim N_1$ соответствует потенциальным возмущениям поля скоростей жидкости, N_2 – вихревым. Слагаемое $\sim N_3$ соответствует возмущениям температурного поля жидкости, обусловленных теплопроводностью.

Пренебрегая вязкостью, что уменьшает устойчивость системы, в балансах нормальных (2) и тангенциальных (3) напряжений из (1), (2) получаем дисперсионное уравнение для капиллярных волн

$$\omega^2 = \omega_0^2(1+a), \quad \omega_0^2 = \sigma m^3/\rho, \quad (14)$$

$$a = \frac{im(\rho_x - 1)}{\mu_3 - \rho_x \mu_2}. \quad (15)$$

Используя (11), (13), преобразуем (15)

$$a = \frac{im(\mu_3 + \rho_x \mu_2)}{\rho_x m^2 - \mu_3^2}. \quad (16)$$

Решение, близкое к $\mu_3 \approx \pm m\sqrt{\rho_x}$, не удовлетворяет условию локализации возмущений (9). Поэтому знаменатель (16) всегда отличен от нуля.

Из (11), (13) следует, что неустойчивость в рассматриваемой системе может развиваться при условии $|\mu_2|, |\mu_3| \gg m$. Пусть выполняется более сильное условие $|\mu_2|, |\mu_3| \gg m$. Тогда $|a| \ll 1$, и для решения (14) можно использовать метод возмущений: $\omega \approx \omega_0(1+a/2)$.

Полагая для определенности $\omega_0 > 0$, из (11), (13) имеем

$$\mu_2 \approx (-1+i)\sqrt{\frac{\rho}{2\eta}\omega_0}, \quad \mu_3 \approx (-1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2g}}. \quad (17)$$

Подставляя (17) в (16), имеем $\Im a > 0$, что определяет устойчивость плоской поверхности жидкости к возникновению капиллярных волн.

Для полученной устойчивости существенное значение имеет учет в (3) тангенциальных напряжений, связанных с возмущениями поверхности жидкости. Их отсутствие, как принято, например, в [3], приводит к прямо противоположному результату. Таким образом, при анализе изменений рельефа поверхности, связанного с термокапиллярными явлениями, важно учитывать в (3), как это сделано в [1, 2], слагаемое $\sim \beta \partial h / \partial x$.

Учет вязкости в (2), (3), как показывает анализ дисперсионного уравнения, приводит к повышению устойчивости рассматриваемой системы.

Таким образом, температурный градиент вблизи свободной плоской поверхности жидкости может являться как дестабилизирующим систему фактором [1-3], так и стабилизирующим.

Л и т е р а т у р а

- [1] Palmer H.Y. - *Y. Fluid. Mech.*, 1976, v. 75, N 3, p. 487-511.
- [2] Левченко Е.Б., Черняков А.Л. - ЖЭТФ, 1980, т. 78, с. 1597-1608.
- [3] Бугаев А.А., Лукошкин В.А., Яковлев Д.Г. - ЖТФ, 1988, т. 58, № 5, с. 908-914.
- [4] Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Зуев И.В., Кокора А.Н. Лазерная и электронно-лучевая обработка материалов. М.: Машиностроение, 1985. 496 с.

Поступило в Редакцию
7 ноября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 24

26 декабря 1988 г.

ОТЖИГ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ПАР ФРЕНКЕЛЯ В n -Ge,
ОБЛУЧЕННОМ ЭЛЕКТРОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ
0.6 МэВ И 1.2 МэВ

А.Н. Крайчинский, Л.В. Мизрухин,
И.С. Рогуткий, В.И. Шаховцов

В [1-11] установлено, что центрированная при $T=65$ К стадия изохронного отжига проводимости кристаллов n -Ge, облученных электронами с энергией ~ 1 МэВ при гелиевых температурах, обусловлена аннигиляцией "замороженных" генетически связанных пар вакансия (У)-межузельный атом (I), получивших название метастабильных пар Френкеля (МПФ). Важным свойством МПФ (радиационных акцепторов) является сдвиг их стадии отжига в область гелиевых температур при облучении "допороговыми" электронами 0.3-0.5 МэВ ($T_{\text{отж}}=5-7$ К [4, 8]) или светом с энергией кванта $h\nu < E_G$ (E_G - ширина запрещенной зоны, $T_{\text{отж}}=4.2$ К [3, 8]). В условиях ионизации кристаллов при подсветке "допороговой" радиацией или светом процесс отжига МПФ характеризуется аномально малым значением энергии активации (4-5 МэВ [4, 8]) и диффузионно-контролируемым движением I к У [4]. Механизм миграции I в неравновесных условиях предложен в [12, 13] и основан на инверсии потенциала для I в процессе перезарядок $I^0 \rightarrow I^\pm \rightarrow \dots$.